

# nanoVTEP ConnectCheck Signal C

## OPE-KS-NV-064-MUX-REF

Article 108711



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun®

Partner for Future Technology

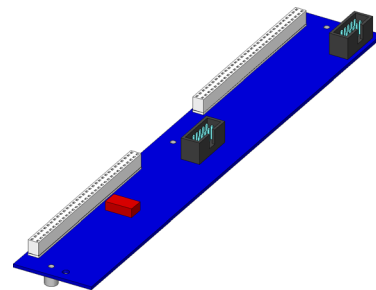
- Composants pour l'Opens-Test en vue d'un contrôle capacitif des puces semi-conductrices en claquages, courts-circuits et défauts de soudure
- Convient à tous les systèmes de test Keysight 307x équipés de la version logicielle 9.2 ou supérieure
- Reproductibilité, couverture de test et détection d'erreurs nettement améliorées comparé à la technologie VTEP.
- 2x 64 contacts, pour raccorder jusqu'à 64 sondes de test nanoVTEP

### Utilisation

Les sondes de test nanoVTEP sont utilisées pour soumettre des circuits intégrés à des tests capacitifs, pour contrôler si les bornes à fils collés à l'intérieur d'un circuit électronique présentent des claquages, courts-circuits et erreurs de soudure.

Les sondes de test NanoVTEP constituent la solution de test Opens Keysight sans vecteur, qui remplace les sondes VTEP jusqu'à présent utilisées. Outre la reproductibilité, la couverture test et la détection des erreurs nettement améliorées, les nouvelles sondes de test nanoVTEP offrent jusqu'à 40 % d'amplification des signaux faibles vu que l'amplificateur est placé à proximité de la plaque de capteur

Les nouvelles nanoVTEP ne fonctionnent qu'en liaison avec les nanoVTEP MUX Boards. Dans une interface de test, aussi bien des sondes de test nanoVTEP que des VTEP peuvent être mises en œuvre combinées entre elles.

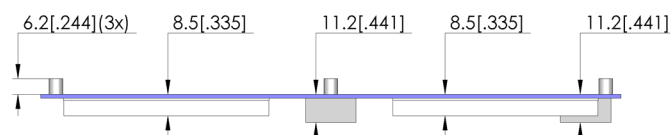
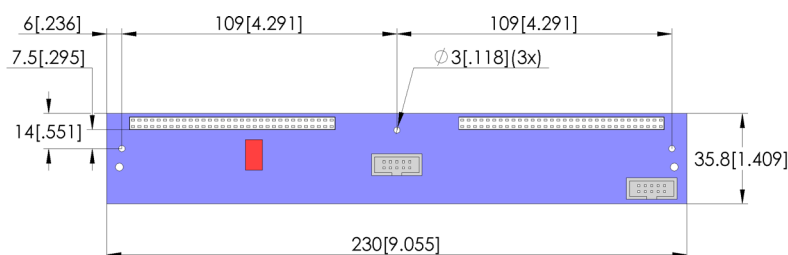


### Remarque :

Pour l'équipement professionnel des sondes de test nanoVTEP Keysight, la consigne d'équipement INFO 4250 est utilisée.

### Remarque :

Les sondes de test NanoVTEP peuvent être utilisées de manière sûre sur tous les systèmes de test Keysight 307x qui utilisent la version logicielle 9.2 ou supérieure. Si la version logicielle que vous utilisez est inférieure à 9.2, merci de vous adresser directement au fabricant du système de test, Keysight.



### Données générales

Groupe de produits:

Série:

Type:

Version:

Type d'accessoire:

Largeur:

Hauteur:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

Opens Tests

OPE

nanoVTEP ConnectCheck Signal C

Accessoires d'équipement

35,8 mm

17,4 mm

10 °C

60 °C

oui

### Adapté aux

Interfaces de test sous vide (VA):

Kits amovibles WS:

VA 2070S/L

### Caractéristiques techniques

Montage:

Nombre de pôles:

Longueur:

Dimensions hors tout (LxPxH):

Filetage M3

2x 64

230 mm

230 x 35,8 x 17,4 mm



DIRECTEMENT AU PRODUIT

### Accessories and single parts

Part no.	Designation	Version
Accessories		
114387	OTU-KS-NV-004-004-G2	nanoVTEP single probe 0.16 inches incl. nanoVTEP
114388	OTU-KS-NV-007-004-G2	nanoVTEP single probe B/C size incl. nanoVTEP
114386	OTU-KS-NV-010-010-G2	nanoVTEP single probe 0.4 inches incl. nanoVTEP
109704	OTU-KS-NV-031-031	nanoVTEP sensor plate 1.2 inches incl. nanoVTEP amplifier and 2x test probes
109705	OTU-KS-NV-065-065	nanoVTEP sensor plate 2.5 inches incl. nanoVTEP amplifier and 2x test probes
109706	OTU-KS-NV-155-013	nanoVTEP sensor plate 152 mm x 12.5 mm incl. nanoVTEP amplifier and 2x test probes
Single parts		
114385	OTC-KS-NV-EP-ST-KS-G2	nanoVTEP (Amplifier, barrel and receptacle)
108707	OTC-KS-NV-EP	nanoVTEP amplifier
114373	OTC-KS-NV-ST-G2	nanoVTEP barrel incl. spring clip
114374	OTC-KS-NV-KS-G2	nanoVTEP receptacle
111606	OTC-KS-NV-GKS	nanoVTEP test probe
108701	OTC-KS-NV-SP-004-004	nanoVTEP single probe 0.16 inches
108702	OTC-KS-NV-SP-007-004	nanoVTEP single probe B/C size
108703	OTC-KS-NV-SP-010-010	nanoVTEP single probe 0.4 inches
108704	OTC-KS-NV-SP-031-031	nanoVTEP sensor plate 1.2 inches
108705	OTC-KS-NV-SP-065-065	nanoVTEP sensor plate 2.5 inches
108706	OTC-KS-NV-SP-155-013	nanoVTEP sensor plate 152 mm x 12.5 mm

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
 78467, Constance, Germany  
 Phone +49 7531 8105-0  
 Customer hotline +49 7531 8105-888  
 Fax +49 7531 8105-65  
 info@ingun.com

